

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-236165

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>G 0 9 G 3/36  
G 0 2 F 1/133

識別記号

7319-5G  
5 7 5

序内整理番号

F I

技術表示箇所

9226-2K

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全13頁)

(21)出願番号

特願平3-197773

(22)出願日

平成3年(1991)8月7日

(71)出願人 000001937

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社  
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番24号

(72)発明者 橋本 一剛

大阪市中央区城見一丁目4番24号 日本電  
気ホームエレクトロニクス株式会社内

(72)発明者 林 秀行

大阪市中央区城見一丁目4番24号 日本電  
気ホームエレクトロニクス株式会社内

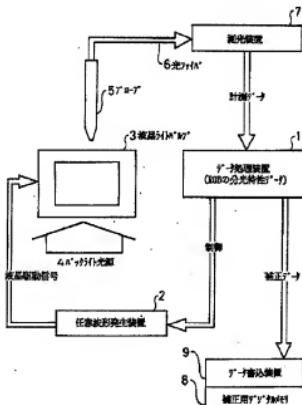
(74)代理人 弁理士 阿仁屋 邦雄 (外2名)

## (54)【発明の名称】 液晶ライトバルブの階調補正情報製作システム

## (57)【要約】

【目的】 液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性に応じた階調補正情報を効率良く短時間で作成できるシステムを提供する。

【構成】 光源4が液晶ライトバルブ3を照らしている状態で、データ処理装置3は任意波形発生装置2に試験信号の発生を指示する。これにより任意波形発生装置2が試験信号を発生して液晶ライトバルブ3に与え、その透過率を変更させる。このとき、測光装置7は透過率を計測する。データ処理装置1は、指示した試験信号と透過率信号から液晶ライトバルブ3の印加電圧-透過率特性をとらえて階調補正情報を作成する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶ライトバルブの階調特性を線形関係とする階調補正情報を作成する液晶ライトバルブの階調補正情報作成システムであって、  
上記液晶ライトバルブを駆動する光源と、  
上記液晶ライトバルブに対する試験信号を発生する試験信号発生手段と、  
上記液晶ライトバルブを透過した光線を受光して透過率信号を出力する測光手段と、  
上記試験信号発生手段に試験信号の発生を指示すると共にそのとき測光手段から与えられる透過率信号に基づいて上記液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性をとらえて階調補正情報を作成するデータ処理手段とを備えたことを特徴とする液晶ライトバルブの階調補正情報作成システム。

【請求項2】 上記データ処理手段が、一旦得られた階調補正情報を利用した試験信号を上記試験信号発生手段から発生させ、上記測光手段からの透過率信号に基づいて、階調補正情報の妥当性を判断し、妥当でない場合には階調補正情報を修正して再度試験信号を発生させての妥当性判断を繰返し、上記液晶ライトバルブの階調特性を線形関係とする階調補正情報を最終的に得ることを特徴とした請求項1に記載の液晶ライトバルブの階調補正情報作成システム。

【請求項3】 階調補正情報の格納用デジタルメモリを備え、上記データ処理手段がこのデジタルメモリに対して得られた階調補正情報を格納せざることを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶ライトバルブの階調補正情報作成システム。

【請求項4】 上記試験信号発生手段が、上記データ処理手段から指令信号に応じた任意波形の信号を発生する任意波形発生部と、階調補正情報の格納用デジタルメモリと、上記任意波形発生部からの信号を上記デジタルメモリに格納されている階調補正情報によって補正した後上記液晶ライトバルブを駆動する液晶駆動部とから構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶ライトバルブの階調補正情報作成システム。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、液晶ライトバルブの階調補正情報（例えば印加電圧-透過率補正情報）を作成するシステムに関する。

## 【0002】

【従来の技術】 液晶表示装置においては、映像信号と光の透過率（透過率）とを線形の関係とすることにより、映像信号のリニアな階調性が保たれ、映像信号の表示画質を適切なものにすることができる。しかし、アクティブラミトリクス型の液晶パネルにおける液晶ライトバルブは、印加電圧と透過率との関係にはない。そこで、液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性に応じて

映像信号を予め補正し、補正前の映像信号と透過率との線形の関係になるようにすることを要する。なお、以下では、このような補正を、印加電圧-透過率補正と呼ぶこととする。

【0003】 また、撮像系においては、表示系で、発光輝度が印加電圧の $\gamma$ 乗に比例する（すなわち発光輝度と印加電圧とは非線形な）プラウン管が適用されることを前提として、映像信号に対して $1/\gamma$ 乗の補正（いわゆる $\gamma$ 補正）を施している。しかしながら、 $\gamma$ 補正是プラウン管に対するものであるので、液晶表示装置においては $\gamma$ 補正是不要である。そこで、液晶表示装置においては、撮像系で行われた $\gamma$ 補正に対する逆補正（以下、逆 $\gamma$ 補正と呼ぶ）を映像信号に対して行なうようにしている。

【0004】 従来、印加電圧-透過率補正回路として、アナログ回路構成の関数発生回路を用いていた。また、逆 $\gamma$ 補正回路としても、アナログ回路構成の関数発生回路を用いていた。なお、実際上、逆 $\gamma$ 補正回路の後段に印加電圧-透過率補正回路を設け、逆 $\gamma$ 補正是 $\gamma$ 補正だけに対するものとし、印加電圧-透過率補正是印加電圧-透過率特性だけに対するものとするようになっている。

【0005】 しかしながら、液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性は、1個の関数では表すことが難しい曲線を有するものであって、近似したとしても3以上の曲線及び直線の組み合わせを用いて表されるものである。そのため、印加電圧-透過率補正を行なう補正回路が複雑になり、また、補正曲線も印加電圧-透過率特性に対して適切なものを得ることが難しい。さらに、理論上求められる補正曲線は急峻な形状を有するものあり、このような急峻な形状部分では、当然に入力電圧の僅かな違いに対して出力電圧が大きく変化し、上述のような補正曲線として適切なもののが得難いという問題がある。従って、従来のアナログ回路を利用した補正方法によれば、印加電圧-透過率補正が不十分であって表示画質を低下させていた。

【0006】 他方、逆 $\gamma$ 補正曲線は、1個の関数で表すことができるものである。しかし、1個の関数で表すことができても、その形状が非線形形状であるため、アナログ回路構成の関数発生回路で適切に実現することは難しく、上述と同様に、逆 $\gamma$ 補正が十分に実行し切れないとも生じていた。

【0007】 このように、映像信号の階調に対する両補正共に不十分であり、両補正が行われた映像信号はそれぞれの補正による不十分度合いを合成了以上に、不適切なものとなり、表示画質の大きな低下を従来では防げることができなかつた。

【0008】 そこで、同一出願人によって、印加電圧-透過率補正を変換テーブルを用いて行なうことや、逆 $\gamma$ 補正を変換テーブルを用いて行なうことや、印加電圧-透過率補正及び逆 $\gamma$ 補正を合成した補正を1個の変換テ

ーブルを用いて行なうこと等が既に提案されている（特願平2-408806号明細書及び図面）。

【0009】ここで、逆 $\gamma$ 補正曲線は、液晶ライトバルブの種類に関係なく一義的に定まるものである。これに対して、印加電圧-透過率補正曲線や、印加電圧-透過率補正曲線及び逆 $\gamma$ 補正曲線の合成曲線は、液晶ライトバルブの種類によって異なるものであり、また、同一種類であっても液晶ライトバルブの各製品によっても微妙に異なるものである。

【0010】そのため、印加電圧-透過率補正を実換データーブルを用いて行なう場合や、印加電圧-透過率補正及び逆 $\gamma$ 補正を合成した補正を1個の変換テーブルを用いて行なう場合には、製品種類毎に、又は、製品毎（若しくはロット毎）に、液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性を測定して補正曲線を求め、補正データを演算して変換テーブルを作成していた。

#### 【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、印加電圧-透過率特性を測定する動作、得られた印加電圧-透過率特性から補正曲線に従う補正データを作成する動作を行ない、一旦、補正データを得たとしてもその確認のために上述した動作を繰返す。そのため、最終的な補正データを得るまでには繁雑な動作が必要であり、時間もかかるものであった。ここで、得られた印加電圧-透過率特性から補正データを得る動作にソフトウェア処理を利用するようにして、多くの手間及び時間がかかるものであった。そのため、製品毎に補正データを作成するようなことは実際上無理があった。

【0012】本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性に応じた階調補正情報を効率良く短時間で作成できる液晶ライトバルブの階調補正情報作成システムを提供しようとするものである。

#### 【0013】

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するため、本発明においては、液晶ライトバルブを照明する光源と、液晶ライトバルブに対する試験信号を発生する試験信号発生手段と、液晶ライトバルブを通過した光線を受光して透過率信号を出力する測光手段と、試験信号発生手段に試験信号の発生を指示すると共にそのとき測光手段から与えられる透過率信号に基づいて液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性をとらえて階調補正情報を作成するデータ処理手段と、液晶ライトバルブの階調特性を縦横関係にする階調補正情報を作成する液晶ライトバルブの階調補正情報作成システムを構成した。

【0014】ここで、上記データ処理手段が、一旦得られた階調補正情報を利用した試験信号を試験信号発生手段から発生させ、測光手段からの透過率信号に基づいて、階調補正情報の妥当性を判断し、妥当でない場合には階調補正情報を修正して再度試験信号を発生させての

妥当性判断を繰り返し、液晶ライトバルブの階調特性を縦横関係とする階調補正情報を最終的に得ることが好ましい。

【0015】なお、階調補正情報の格納用デジタルメモリを備え、データ処理手段がこのデジタルメモリに対して作成した階調補正情報を格納させることが好ましい。

【0016】また、試験信号発生手段が、データ処理手段からの指令信号に応じた任意波形の信号を発生する任意波形発生部と、階調補正情報の格納用デジタルメモリと、上記任意波形発生部からの信号をデジタルメモリに格納されている階調補正情報によって補正した後液晶ライトバルブを駆動する液晶駆動部とから構成されていることが好ましい。この場合には、作成した階調補正情報を取り立てて格納するデジタルメモリを設けることは当然に不要である。

#### 【0017】

【作用】本発明の液晶ライトバルブの階調補正情報作成システムにおいて、光源が液晶ライトバルブを照明している状態で、データ処理手段は、試験信号発生手段に試験信号の発生を指示し、これにより試験信号発生手段が試験信号を発生して液晶ライトバルブに与え、透過率を変更させる。このとき、測光手段は透過率を計測し、透過率信号をデータ処理手段に与える。データ処理手段は、指示した試験信号と透過率信号とから液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性をとらえて階調補正情報を作成する。このように効率良く短時間で階調補正情報を作成できるシステムを実現できる。

【0018】ここで、作成された階調補正情報が妥当であるか否かを確認することが望ましい。そこで、データ処理手段が、一旦得られた階調補正情報を利用した試験信号を試験信号発生手段から発生させ、測光手段からの透過率信号に基づいて、階調補正情報の妥当性を判断し、妥当でない場合には階調補正情報を修正して妥当性判断を繰返すことが好ましい。

【0019】なお、当該システムが作成した階調補正情報をそれぞのデジタルメモリに格納する動作をも行なうことが望ましい。

【0020】また、試験信号発生手段、データ処理手段からの指令信号に応じた任意波形の信号を発生する任意波形発生部と、階調補正情報の格納用デジタルメモリと、上記任意波形発生部からの信号をデジタルメモリに格納されている階調補正情報によって補正した後液晶ライトバルブを駆動する液晶駆動部と構成すると、実際の液晶表示装置に即した状態で印加電圧-透過率特性の測定を行なうことができる。

#### 【0021】

##### 【実施例】

###### （1）第1実施例

以下、本発明の第1実施例を図面を参照しながら詳説する。この第1実施例は、液晶ライトバルブに対して液晶

駆動回路を組み込んでいない状態で印加電圧－透過率特性を測定して補正データを作成するシステムに関するものである。

#### 【0022】(1-1) 第1実施例の構成

図1は、この第1実施例システムの全体構成を示すブロック図である。図1において、データ処理装置1は後述する図2に示す処理に従って当該システムの全体を制御するものであり、最終的には、変換テーブルを構成する補正用デジタルメモリ(ROM)に補正データを書き込むようにさせるものである。データ処理装置1は、印加電圧－透過率特性の測定時や一旦作成した補正データの直線性を確認する際には、任意波形発生装置2に任意波形電圧信号(試験信号)を出力させるように制御する。任意波形発生装置2は、データ処理装置1による指令電圧を中心とした任意波形電圧信号(映像信号に対応する)を発生し、これを液晶駆動信号として液晶ライトバルブ3に与える。

【0023】この実施例における液晶ライトバルブ3は、X方向及びY方向がショートされたものを用いる。すなわち、全てのセルが液晶駆動信号に応じて同時にスイッチングされるものを用いる。

【0024】この液晶ライトバルブ3を挟んで一方にパックライト光源4が設けられ、他方にこの液晶ライトバルブ3を通した光線を捕捉する光線捕捉用のプローブ5が設けられている。プローブ5で捕捉した光線は、例えば光ファイバ6を介して測光装置7に与えられる。なお、液晶ライトバルブ3は、どの位置でも印加電圧－透過率特性がほぼ同一であり、プローブ5の設置位置は液晶ライトバルブ3の透過面に面していればいいなる位置でも良い。

【0025】ここで、3原色R、G、Bのモザイク配列でなるカラーフィルタを有する液晶ライトバルブ3を対象とした場合には、光源4として白色光源を用いると共に、測光装置7として分光計を用いる。この場合には、分光計からのスペクトルデータから赤、青、緑の3個の波長域の輝度又は放射束(放射束と輝度の間に、放射束×視認度特性=輝度という関係がある)のデータ(これは透過率を表したものである)をデータ処理装置1が取り込む。

【0026】また、液晶ライトバルブ3に赤、青、緑のいずれかの単色フィルタを掛けたバックライト光源4として白色光源を用い、又は、液晶ライトバルブ3にフィルタをかけることなくバックライト光源4として赤、青、緑のいずれかの単色光源を用いて、各原色信号R、G、B用の補正データを作成しようとする場合には、測光装置7として輝度計を用いる。この場合には、いずれかの原色信号の輝度データ(これも透過率を表したものである)がデータ処理装置1に取り込まれる。

【0027】データ処理装置1には、補正用デジタルメモリ(例えばROM)8に対するデータ書込装置9が接続されており、データ処理装置1が図2に示す処理を実行して最終的に得た補正データをこのデータ書込装置9に与えて補正用デジタルメモリ8に書き込むように制御する。

【0028】(1-2) 第1実施例における処理

次に、データ処理装置1が実行するある原色信号に対する処理を図2を用いて説明する。ここで、図2(A)はメインルーチンを示し、図2(B)は印加電圧－透過率特性の測定の具体的な処理を示すサブルーチンを示し、図2(C)は補正処理後の特性の直線性を確認する具体的なサブルーチンを示したものである。

【0029】データ処理装置1は、まず、当該システムのイニシャライズを行なった後、1回目の印加電圧－透過率特性の測定処理を行なう(ステップSP1、SP2)。その後、かかる測定結果に基づいて、補正する入力電圧の範囲を設定する(ステップSP3)。例えば、液晶ライトバルブ3の透過率が可変する入力電圧の最小値から最大値までの範囲を設定する。

【0030】続いて、データ処理装置1は、設定した範囲の入力電圧を印加電圧とした2回目の透過率の測定を行なう(ステップSP4)。ここで、1回目と2回目とは、上述したように印加電圧の可変範囲が異なると共に、さらに、2回目の測定が主なる測定であるので電圧の可変ステップも細くなっている。

【0031】このようにして印加電圧－透過率特性が得られると、後述するようにして補正データを作成する(ステップSP5)。ここで、印加電圧、透過率及び補正データを全て正規化して扱う。例えば、印加電圧の最小値を0、最大値を1にする正規化を行なうと共に、それに応じた透過率も最小値を0、最大値を1に正規化し、さらに、入力電圧を印加電圧に補正する補正データにおいても補正前の入力電圧及び補正後の印加電圧を最小値を0、最大値を1に正規化する。この実施例の場合、このステップの処理で得られた補正データは、データ処理装置1内のパッファメモリに格納される。

【0032】補正データを得ると、得られた補正データの真直しを実行する。すなわち、補正データを適用した場合に、補正前の入力電圧(印加電圧ではない)と透過率との線形関係にあるか否かを確認する(ステップSP6)。

かかる処理によって補正データが妥当でない場合には、この線形関係の確認処理内で補正データの修正を行なう。

【0033】このようにして入力電圧(補正前の電圧)と透過率との線形関係が得られると、補正用デジタルメモリ(例えばROM)8に対するデータ書込装置9に最終的な補正データを与え、この最終的な補正データをこのデータ書込装置9によって補正用デジタルメモリ8に書き込むようにさせる(ステップSP7)。

【0034】次に、ステップSP2又はSP4における印加電圧－透過率特性の測定処理を図2(B)を用いて

詳述する。

【0035】かかる処理ではありません、印加電圧として最小値を設定する(ステップSP10)。これにより、任意波形発生装置2からこれに応じた液晶駆動信号が取出されて液晶ライトバルブ3の透過率制御動作がなされる。ここで、1回目の測定処理(ステップSP2)は補正する入力電圧の範囲を得るためのものであるのでこの最小値は十分に小さい値であり、2回目の測定処理(ステップSP4)においては設定された範囲の最小値である。

【0036】次に、現在の対象電圧が測定範囲の最大値でないことを確認して(ステップSP11)、そのときの測光装置7の出力データを取り込む(ステップSP12)。すなわち、現在の対象電圧に対する透過率を測定する。なお、ここでも、1回目の測定処理は補正する入力電圧の範囲を得るためのものであるのでこの最大値は十分に大きい値であり、2回目の測定処理においては設定された範囲の最大値である。

【0037】このようにしてある電圧に対する透過率の測定が終わると、測定対象電圧を今より測定分解能分だけ大きくして上述したステップSP11に戻る(ステップSP13)。

【0038】ステップSP11～SP13でなる処理ループを繰り返すことにより、最小値から最大値までの測定分解能分ずつ異なる各電圧に対する透過率を測定することができ、最大値電圧に対する透過率を測定し終えると、ステップSP11において肯定結果が得られ、メインルーチン(図2(A))に戻る。

【0039】次に、補正データを適用した場合に、補正前の入力電圧(印加電圧ではない)と透過率との線形関係にあるか否かを確認するステップSP6の処理を、図2(C)を用いて詳述する。

【0040】かかる処理に入ると、データ処理装置1はまず、補正しようとする入力電圧範囲の最小電圧をその電圧に対応した補正データを用いて補正した補正後最小電圧を印加電圧として設定する(ステップSP20)。これにより、任意波形発生装置2からこれに応じた液晶駆動信号が取出されて液晶ライトバルブ3の透過率制御動作がなされる。

【0041】次に、現在の対象入力電圧が最大値でないことを確認して(ステップSP21)、そのときの測光装置7の出力データを取り込む(ステップSP22)。すなわち、現在の補正後の対象電圧に対する透過率を測定する。そして、この透過率が補正前の電圧値に対する線形関係にあるか否かを、線形関係があった場合の透過率との誤差が所定の規定値以内か否かで判断する(ステップSP23)。

【0042】かかる判断で否定結果を得ると、そのときの誤差に応じて補正データを修正して任意波形発生装置2に与える補正後の電圧も変更して上述したステップSP22に戻る(ステップSP24)。他方、かかる判断

で肯定結果を得ると、現在対象となっている補正前の電圧を所定電圧だけ大きくして上述したステップSP21に戻る(ステップSP25)。

【0043】このようにして各入力電圧をそれに対応する補正データを用いて補正した電圧による透過率と、入力電圧とに線形関係があるか否かを確認することができ、否定結果を得た場合は線形関係を満足するよう補正データを修正することができ、入力電圧の最大値に対する処理が終したときにメインルーチンに戻る。

【0044】(1-3) 補正データの作成方法

次に、ステップSP5の処理による補正データの作成方法を、図面をも参照しながら詳述する。

【0045】図3は、液晶ライトバルブ3についての正規化されている印加電圧-透過率特性曲線と、印加電圧-透過率補正曲線との関係を示す説明図である。液晶ライトバルブ3に対する印加電圧(横軸x)と、その印加電圧における透過率(縦軸y)との間に、図3の曲線C1に示すようにS字曲線上の関係がある。ここで、補正前の入力電圧(通常の表示動作時における映像信号電圧が該当する)と透過率とを図3の点線C2に示すように線形関係とするために(ここでは逆アブ正を考慮していない)、入力電圧を補正し、補正後の電圧(印加電圧)に対して曲線C1に示す特性が適用されても元の入力電圧と透過率との間には点線C2に示すように線形な関係が生じるようにすることを要する。ここで、このような補正曲線C3は、正規化された座標系においては、点線C2に対して曲線C1に線対称な曲線となる。従って、補正曲線C3を求めるためには、上述したようになります。印加電圧-透過率特性曲線C1を求める、その後、この曲線C1の逆特性を求めれば良い。なお、印加電圧-透過率補正曲線C3上の各点の入出力関係を求める補正データである。従って、測定の結果得られた印加電圧-透過率特性曲線C1から印加電圧-透過率補正曲線C3を得れば、結果として補正データが得られる。

【0046】印加電圧-透過率特性曲線C1から印加電圧-透過率補正曲線C3を得る方法として、グラフ上の対称点を検出する方法と、閏数近似による方法がある。

【0047】まず、グラフ上の対称点を検出する方法を図3を用いて説明する。今、印加電圧-透過率特性曲線C1上のある点Aに着目したとする。そして、線形関係にある点線C2に対するこの点Aの距離L及びこの距離Lを規定する点線C2上の点Bを求める。次に、点Bを通じて点線C2から距離Lだけ離れた点Dを求める。このような処理を印加電圧-透過率特性曲線C1の全点に対して実行することで印加電圧-透過率補正曲線C3を得る。

【0048】次に、閏数近似による方法を図4を用いて説明する。なお、閏数近似による方法の詳細は、特願平2-408806号明細書及び図面に開示されている。

【0049】この方法は、印加電圧-透過率特性曲線C1を閏数近似し、その逆関数を求ることで印加電圧-透過率補正曲線C3を求める方法である。ここで、印加電圧-透過率特性曲線C1は、上述したようにS字状曲線であるため、1個の閏数によって表現することは困難である。そこで、印加電圧-透過率特性曲線C1の中央部を直線で近似し、その前後を所定の閏数曲線で近似することとした。

【0050】図4はこのような各近似閏数の説明図である\*

$$y = f(x) = a_1 \cdot x^{b_1}$$

(a1及びb1は定数であり、x及びyはそれぞれ $\leq$ と $\geq$ である)

$$y = g(x) = a_2 \cdot x + c_2$$

(a2及びc2は定数であり、x及びyはそれぞれP1★

$$y = h(x) = a_3 \cdot (1-x)^{b_3}$$

(a3及びb3は定数であり、x及びyはそれぞれP2 $\leq$ x<1、Q2 $\leq$ y<1の範囲の値である)

このように印加電圧-透過率特性曲線C1を閏数f(x)、g(x)、h(x)を用いて近似した場合、印加電圧-透過率補正曲線C3は、上述したように、また図4に示すように、これらの逆閏数 $f^{-1}(x)$ 、 $g^{-1}(x)$ 、 $h^{-1}(x)$ を用いて近似することができます。

【0052】測定によって得られた印加電圧-透過率特性曲線C1から印加電圧-透過率補正曲線C3を求める具体的な処理手順は、以下の通りである。

【0053】まず、印加電圧-透過率特性曲線C1の各点の係数に基づいて、曲線C1を第1の曲線部分、直線部分及び第2の曲線部分に3分割すると共に、分割点E、Fの座標をとらえる。第1及び第2の曲線部分のそれぞれについて中間の点G、Hを定め、その座標をとらえる。各近似閏数f(x)、g(x)、h(x)を特定する各係数a1~a3、b1、b3、c2を演算する。この係数を利用して逆閏数 $f^{-1}(x)$ 、 $g^{-1}(x)$ 、 $h^{-1}(x)$ を求める。各逆閏数 $f^{-1}(x)$ 、 $g^{-1}(x)$ 、 $h^{-1}(x)$ が適用される範囲を明らかにする。そして、入力値(x方向の点)の値に応じた補正後の値を入力値の全範囲について定める。

【0054】(1-4) 第1実施例の効果

従って、第1実施例によれば、液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性に応じた階調補正情報を効率良く短時間で作成でき、補正用デジタルメモリに格納できる液晶ライトバルブの階調補正情報をシステムを実現することができる。

【0055】なお、このようなシステムを適用して補正データを作成する対象は、液晶ライトバルブの種類等であっても良く、また、同一種類であってもロット毎や製品毎であっても良い。後者の場合には、効率良く補正データを作成格納できるという効果は非常に大きな効果である。

【0056】(1-5) 第1実施例の変形

上述の説明においては、データ処理装置1から任意波形

\*る。この図4に示すように、座標原点側の曲線部分を開数y=f(x)で表し、中央部分を開数y=g(x)で表し、それより大きい値の曲線部分を開数y=h(x)で表す。また、閏数f(x)と閏数g(x)との接続点座標をE(P1、Q1)で表し、閏数g(x)と閏数h(x)との接続点座標をF(P2、Q2)で表す。そして、各閏数f(x)、g(x)、h(x)をそれぞれ(1)式、(2)式、(3)式で近似することとした。

【0051】

(1)

※ $x < P_1$ 、 $0 \leq y < Q_1$ の範囲の値である

(2)

★ $\leq x < P_2$ 、 $Q_1 \leq y < Q_2$ の範囲の値である

(3)

発生装置2に与える電圧信号を $\gamma$ 補正を実行していないものとし、液晶ライトバルブ3の印加電圧-透過率特性に対応した補正データを作成するものを示したが、測定された印加電圧-透過率特性から、印加電圧-透過率補正及び $\gamma$ 補正を同時に行なう補正データを作成するようにもしても良い。例えば、データ処理装置1に逆 $\gamma$ 補正データを予め格納しておき、得られた印加電圧-透過率補正データと予め格納しておいた逆 $\gamma$ 補正データとを合成して補正用デジタルメモリ8に対する補正データを作成するようにもしても良い。

【0057】上述の第1実施例では、カラー用液晶ライトバルブ3を対象としたものを示したが、白黒用液晶ライトバルブを対象とした補正データの作成格納もその実施例の内容を適用することができる。ここで、バックライト光源4として白色光源を適用し、測光装置5として輝度計を適用することで白黒用にも対応することができる。

【0058】また、一旦得られた補正データの確認の際には補正した電圧信号を任意波形発生装置2に与えるものを示したが、補正データを任意波形発生装置2に与えて任意波形発生装置2に補正処理を実行させるようにも良い。

【0059】(2) 第2実施例

次に、本発明の第2実施例システムを図面を用いて説明する。この第2実施例は、印加電圧-透過率特性の測定40系に補正用デジタルメモリが介在している点や液晶駆動回路を備えている点等が第1実施例と構成上異なる。

【0060】図5がこの第2実施例の全体構成を示すブロック図であり、図1との対応部分には同一符号を付して示している。図5において、この実施例のデータ処理装置1はいすれの処理段階においても任意波形発生装置3に対して印加電圧-透過率補正を実行していない電圧信号を出力する。この点、第1実施例におけるデータ処理装置とは異なる。

【0061】この実施例の任意波形発生装置3は、水平

同期信号や垂直同期信号を有するテレビジョン信号フォ

一マットに従う、しかもその映像部にはデータ処理装置1からの電圧信号を中心とした任意波形を有するビデオ信号を発生して液晶駆動回路10に与える。この液晶駆動回路10には補正用デジタルメモリ8が関連して設けられており、液晶駆動回路10は任意波形発生装置3からの映像信号を補正用デジタルメモリ8を用いて補正して液晶ライトバルブ3を駆動する。なお、データ処理装置1が出した補正データは、データ書き込み装置9によって補正用デジタルメモリ8に書き込まれる。

【0062】この実施例の液晶ライトバルブ3は、X方向及びY方向をショートしていた第1実施例の液晶ライトバルブとは異なり、液晶駆動回路10による駆動制御を受けたセルが透過率制御されるものである。

【0063】この第2実施例におけるバックライト光源4、プローブ5、光ファイバ6、測光装置7は、第1実施例と同様であり、その詳細説明は省略する。

【0064】次に、この第2実施例の処理の流れを説明する。基本的な流れは、第1実施例の処理の流れとは同様である。

【0065】まず、データ処理装置1はシステムの初期化を行なう。この際、補正用デジタルメモリ8には、線形関係の補正データ、從って補正を実行しない補正データを格納させる。このようす状態で、任意波形発生装置2から映像部の電圧が所定電圧の映像信号を出力させてその所定電圧での印加電圧-透過率特性の予備的な測定を行ない、この所定電圧を順次変化させることで全電圧範囲についての印加電圧-透過率特性の予備的な測定を行なう。なお、この際には、補正用デジタルメモリ8に線形関係の補正データを格納しているので、任意波形発生装置2からの映像信号によって液晶駆動回路10が液晶ライトバルブ3を駆動することになる。

【0066】その後、かかる測定結果に基づいて、補正する入力電圧の範囲を設定する。そして、データ処理装置1は、設定した範囲内のある入力電圧信号を映像部の中心電圧に設定した映像信号を任意波形発生装置2から出力させて透過率の測定を行ない、入力電圧信号を徐々に変換することで設定した範囲の全域に対する印加電圧-透過率特性の測定を行なう。この際にも、映像信号の補正是実行されていない。

【0067】このようにして印加電圧-透過率特性が得られると、第1実施例と同様にして補正データを作成し、作成した補正データを補正用デジタルメモリ8に格納させる。そして、1回目及び2回目の透過率測定と同様にして透過率測定を実行する。この際には、補正用デジタルメモリ8に補正データが格納されているので、任意波形発生装置2が出した映像信号が、格納されている補正データに応じて補正された後に液晶ライトバルブ3に供給される。

【0068】データ処理装置1は、この際測定された透過率に基づいて補正データの妥当性を確認する。妥当で

ない補正データがあるとそれを修正し、補正用デジタルメモリ8を更新して修正後の補正データの妥当性を再確認する。全範囲について妥当である場合には一連の処理を終了する。

【0069】従って、この第2実施例においても、第1実施例と同様な効果を得ることができる。

【0070】この第2実施例についての変形例としても、白黒用ライトバルブに適用することや、印加電圧-透過率補正及び逆アダマツの合成補正データを得るようになることなどが考えられる。

【0071】(3) 第3実施例

次に、本発明の第3実施例システムを図面を参照しながら詳説する。この第3実施例は、液晶プロジェクタ等の投射型表示装置に用いられる液晶ライトバルブに対するものである。図6はこの第3実施例の全体構成を示すプロック図であり、図7はプローブの設置位置の説明図である。

【0072】この第3実施例の構成は、図6に示すように、第2実施例とほぼ同様な構成を有する。しかし、投射型用であるので光源として照明光源4を用いている点、液晶ライトバルブ3を透過した光線を受光するスクリーン11を有する点、プローブ5の設置位置が図7に示すように液晶ライトバルブ3の背面に限定されるものではなく、むしろスクリーン11が反射型であればスクリーン11の前面、スクリーン11が透過型であればスクリーン11の後方が好ましい点、測光装置7として分光反射計を適用する点が第2実施例と異なる。

【0073】以上のように、構成上多少に違いはあるにしろ、処理の流れは第2実施例と同様であるので、その説明は省略する。

【0074】この第3実施例によても、第1及び第2実施例と同様な効果を得ることができる。投射型表示装置に用いられる液晶ライトバルブに対するシステムとしては、第1及び第2実施例のシステムより好適なものである。

【0075】この第3実施例についての変形例としても、白黒用ライトバルブに適用することや、印加電圧-透過率補正及び逆アダマツの合成補正データを得るようになることなどが考えられる。

【0076】(4) 他の実施例

上記システムにおける補正用デジタルメモリ8としては製品に直接組み込まれるものであっても良く、多数のデジタルメモリを複数個するためのマスターであっても良い。例えば、同一種類の液晶ライトバルブに対して同一の補正データを適用する場合には後者となる。

【0077】

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、液晶ライトバルブの印加電圧-透過率特性の測定及び得られた印加電圧-透過率特性から階調補正情報の測定を効率良く短時間で実行することができる液晶ライトバルブの階

調補正情報作成システムを実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例システムの構成を示すブロック図である。

【図2】第1実施例システムの処理の流れを示すフロー  
チャートである。

【図3】補正データの作成方法の説明図（その1）であ  
る。

【図4】補正データの作成方法の説明図（その2）であ  
る。

【図5】第2実施例システムの構成を示すブロック図で\*

\*ある。

【図6】第3実施例システムの構成を示すブロック図で  
ある。

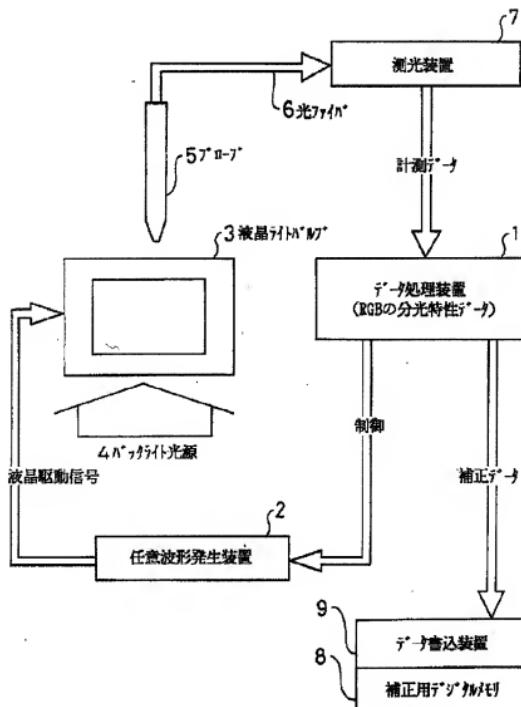
【図7】第3実施例システムの受光用プローブの設置位  
置の説明図である。

【符号の説明】

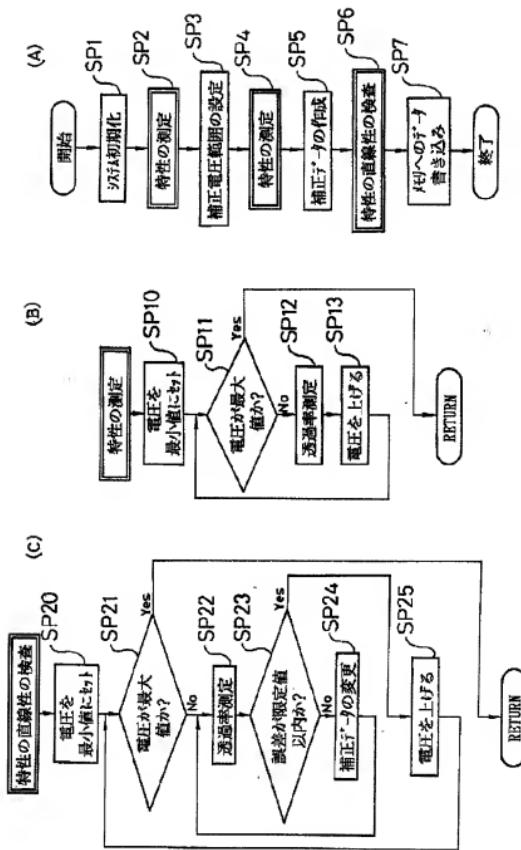
1…データ処理装置、2…任意波形発生装置、3…液晶  
ライトバルブ、4…光源、5…受光用プローブ、6…光  
ファイバ、7…測光装置、8…補正用デジタルメモリ、

10…データ書込装置、11…液晶駆動回路、12…スクリ  
ーン。

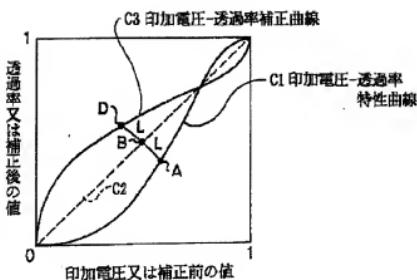
【図1】



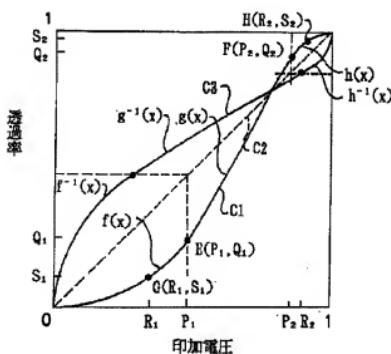
【図2】



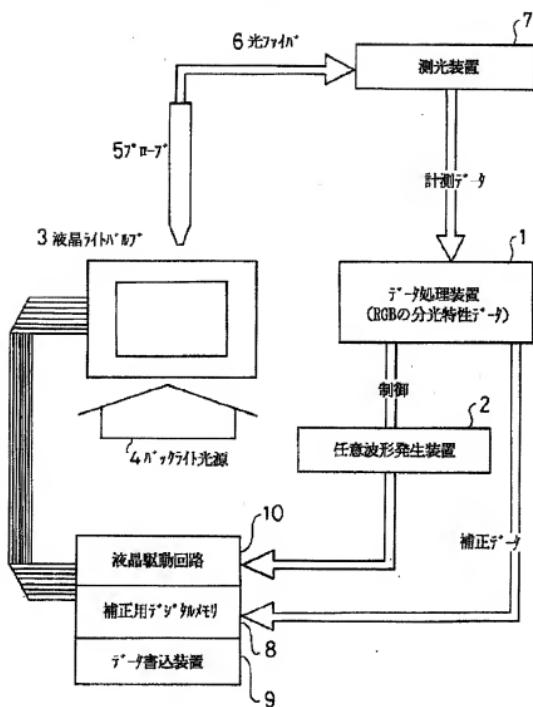
【図3】



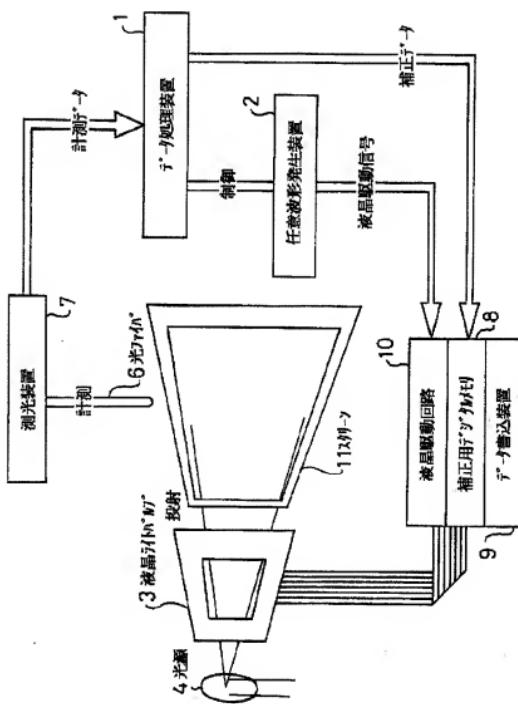
【図4】



【図5】



【図6】



【図7】

